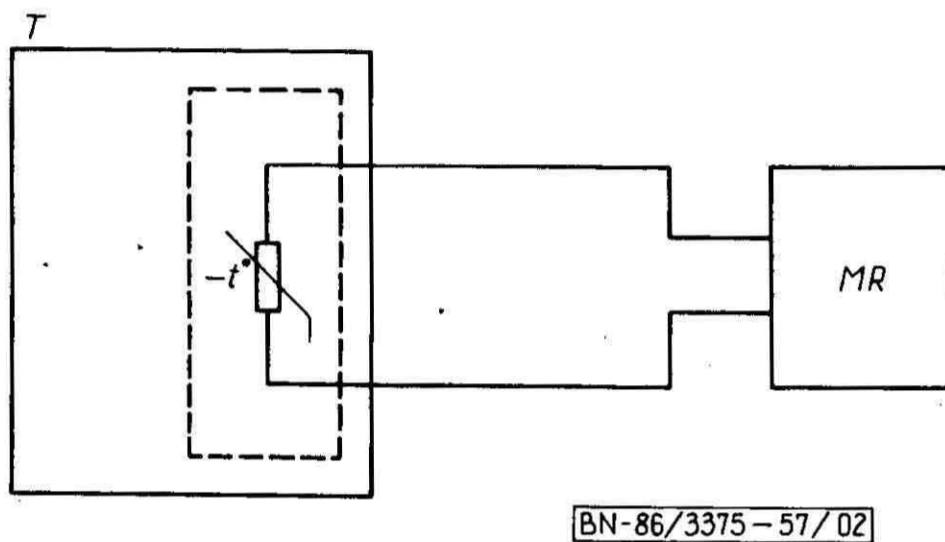


|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| ELEMENTY<br>URZĄDZEŃ<br>ELEKTRONICZNYCH | N O R M A   B R A N Ż O W A                       | BN-86                 |
|   | Termistory o skokowym spadku<br>rezystancji (CTR) | 3375-57/02            |
|   | <b>Metody pomiaru parametrów</b>                  | -                     |
|   | Pomiar rezystancji                                | Grupa katalogowa 1921 |

**1. Przedmiot arkusza normy.** Przedmiotem arkusza normy jest metoda pomiaru rezystancji (statycznej) termistora CTR.

**2. Warunki pomiaru.** Pomiar należy wykonać w układzie wg rysunku, w określonej temperaturze otoczenia, przy mocy pomiarowej nie powodującej zmian rezystancji większych niż uchyb wywołany dokładnością miernika.



$T$  — termostat,  $-t^\circ$  — termistor,  $MR$  — miernik rezystancji

Temperatura otoczenia w czasie pomiaru rezystancji powinna wynosić  $25 \pm 0,1^\circ\text{C}$ .

**3. Dokładność pomiaru.** Dokładność pomiaru powinna być taka, aby błąd pomiaru nie przekraczał 1% tolerancji.

W przypadku pomiaru zmian rezystancji, dokładność pomiaru powinna być taka, aby błąd pomiaru nie przekraczał 0,1% największej dopuszczalnej zmiany rezystancji.

**4. Wykonanie pomiaru.** Termistor należy przyłączyć do zacisków pomiarowych miernika w odległości  $25 \pm 1,5$  mm od obudowy termistora i umieścić w środowisku zapewniającym stałość temperatury otoczenia oraz izolację wg BN-86/3375-57/01 p. 2.2.

Napięcie pomiarowe należy przykładać na odpowiednio krótkie okresy tak, aby w czasie pomiaru, przy odczycie wartości mierzonej rezystancji nie występował spadek rezystancji termistora.

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa.
2. Normy związane  
BN-86/3375-57/01 Termistory o skokowym spadku rezystancji (CTR). Metody pomiaru parametrów. Postanowienia ogólne
3. Symbol wg SWW — 1156-116.
4. Autor projektu normy — mgr inż. Zdzisław Piętaszewski — Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa.

Zgłoszona przez Instytut Technologii Elektronowej  
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 31 grudnia 1986 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 czerwca 1987 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1987, poz. 10)